



# 計測・分析 合同地域セミナー

2026 3 / 31 (火)

参加費  
無料

13:30~17:00  
(受付開始: 13:00)

会場: キャンパスプラザ京都  
第4講義室 (4F)

アクセス:  
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939  
京都市営地下鉄烏丸線・近鉄京都線・JR各線  
「京都駅」下車 徒歩5分

ARIMにおける重要技術領域「マルチマテリアル化技術・次世代高分子マテリアル」に関連し、京都大学・大阪大学・奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)が保有する電子顕微鏡等の計測装置群の機能紹介を行います。各装置の特色を活かした利用事例や最新の研究成果に加え、ARIM事業により収集された計測データの利活用についても議論します。

NIMSより松波成行氏をお招きし、データ活用の最新動向をご紹介いただきます。

本イベントが、3機関における電子顕微鏡技術の特色理解と、研究・データ利活用に関する活発な議論の機会となることを期待しております。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

## プログラム

13:00 ~	受付開始	
13:30 ~13:45	京都大学の計測・分析装置の紹介	治田 充貴 (京都大学)
13:45 ~14:00	大阪大学の計測・分析装置の紹介	光岡 薫 (大阪大学)
14:00 ~14:15	NAISTの計測・分析装置の紹介	畠谷 茂隆 (NAIST)
14:15 ~14:45	ARIMが拓くデータ共用サービスの新展開 ~リアルデータを利用してマテリアルAI研究を加速しよう~	松波 成行 (NIMS)
14:45 ~15:00	休憩	
15:00 ~15:30	モノクロメータ付きEELSを用いた有機薄膜太陽電池の構造解析	稲元 伸 (TRC)
15:30 ~16:00	超高压電子顕微鏡を用いた半導体デバイスの不良箇所の観察	高田 里菜 (ローム株式会社)
16:00 ~16:30	金属ナノ粒子担持赤血球ゴーストの設計と機能発現	越山 友美 (立命館大学)
16:30 ~17:00	非剛体レジストレーションを用いたAPT-STEMトモグラフィー相関顕微解析法の開発	赤瀬 善太郎 (NAIST)

### 参加登録:

氏名/所属機関/e-mailを記入の上、下記e-mailにお申し込みください。  
(e-mail) arim@eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp